# УДК 539.21

# РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ У ДЕФОРМИРУЕМОЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ НЕКОГЕРЕНТНОГО КЛИНОВИДНОГО ОСТАТОЧНОГО МЕХАНИЧЕКОГО ДВОЙНИКА

## Ю. С. КРОТЕНОК, О. М. ОСТРИКОВ

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь

#### Введение

Механическое двойникование представляет собой закономерную переориентацию кристаллической решетки под действием механической нагрузки. Атомная перестройка кристаллической решетки при двойниковании происходит с соблюдением определенных кристаллографических соотношений, при этом атомы в соседних плоскостях перемещаются на расстояния, равные долям параметра решетки [1].

Проблема разрушения материалов, неоднократно рассмотренная для различных условий механических испытаний, представляет собой сложный комплекс научных и технических вопросов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что разрушение – «процесс кинетический, статистический, многостадийный и многомасштабный» [1]. Одной из наиболее важных стадий в развитии разрушения является стадия накопления повреждений, на которой имеет место дислокационное формирование зародышевой микротрещины [1]. Активную роль в зарождении трещин играет механическое двойникование, которое приводит к концентрации высокого уровня напряжений на границах раздела «двойник – материнский материал», создающих благоприятные условия для образования трещин. Механизмы, вызывающие разрушение при двойниковании, в настоящее время выяснены еще недостаточно [1], [2]. Поэтому разработка методов расчета напряженно-деформированного состояния двойникующихся материалов является актуальной.

Целью данной работы является синтез математической модели для расчета и графической визуализации нормальных компонент напряжений в деформируемом твердом теле при наличии в нем двойника.

#### Постановка задачи

На рис. 1 схематически представлен клиновидный двойник у поверхности двойникующегося материала. Длина двойника – L, а его ширина у устья – H. Форму границ опишем функциями  $f_1(\xi)$  и  $f_2(\xi)$ . Направим ось X вдоль поверхности кристалла, а ось Y перпендикулярно ей, вдоль направления развития двойника.

Пусть поверхность деформируется в точке O вдоль оси Y сосредоточенной нормальной нагрузкой P, перпендикулярной поверхности, и тангенциальной сосредоточенной нагрузкой Q. Тогда в упругом полупространстве будут действовать нормальные напряжения, которые могут быть определены по формулам [2], [3]:

$$\sigma_{xx}^{e}(x,y) = -\frac{2}{\pi} \left( \frac{x^{2}(P+Q)}{(x^{2}+y^{2})^{2}} \right);$$

$$\sigma_{yy}^{e}(x,y) = -\frac{2}{\pi} \left( \frac{y^{2}(P+Q)}{\left(x^{2}+y^{2}\right)^{2}} \right).$$
(1)

Напряжения, создаваемые клиновидным двойником, можно рассчитать из соотношения [2]:

$$\sigma_{ij}^{(tw)}(x,y) = \sigma_{ij}^{(1)}(x,y) + \sigma_{ij}^{(2)}(x,y),$$
(2)

где  $\sigma_{ij}^{(1)}(x, y)$  и  $\sigma_{ij}^{(2)}(x, y)$  – напряжения, которые, как это было показано в [2], создаются каждой границей двойника и определяются с помощью криволинейных интегралов:

$$\sigma_{ij}^{(1)} = \int_{L_{d_1}} \rho_1 \sigma_{ij}^{(1,0)} ds;$$
(3)

$$\sigma_{ij}^{(2)} = \int_{L_{dy}} \rho_2 \sigma_{ij}^{(2,0)} ds,$$
(4)

где  $L_{A1}$  и  $L_{A2}$  – профили двойниковых границ;  $\rho_1$  и  $\rho_2$  – плотности двойникующих дислокаций на двойниковых границах;  $\sigma_{ij}^{(1,0)}$  и  $\sigma_{ij}^{(2,0)}$  – определяются из соотношений, приведенных в [2].



*Рис.* 1. Схематичное объемное изображение клиновидного двойника у деформируемой сосредоточенной нагрузкой поверхности твердого тела

Двойникующие дислокации являются частичными дислокациями Шокли [4], [5]. Поэтому их вектор Бюргерса b можно разложить на винтовую  $b_{\rm B}$  и краевую  $b_{\rm KP}$  составляющие, направление которых примем таким, как это показано на рис. 1. Тогда выражения (3) и (4) можно свести к определенным интегралам вида [2]:

$$\sigma_{ij}^{(1)}(x,y) = \int_{0}^{L} \sqrt{1 + (f_{1}'(\xi))^{2}} \rho_{1}(\xi) \sigma_{ij}^{(1,0)}(x,y,\xi) d\xi;$$
(5)

$$\sigma_{ij}^{(2)}(x,y) = \int_{0}^{L} \sqrt{1 + (f_{2}'(\xi))^{2}} \rho_{2}(\xi) \sigma_{ij}^{(2,0)}(x,y,\xi) d\xi.$$
(6)

Здесь  $\xi$  – параметр интегрирования.

При фиксированных источниках внутренних напряжений в упругом полупространстве справедлив принцип суперпозиции, согласно которому результирующие напряжения в деформируемом сосредоточенной нагрузкой полупространстве при наличии у поверхности двойника, могут быть найдены по следующей формуле:

$$\sigma_{ij}(x,y) = \sigma_{ij}^e(x,y) + \sigma_{ij}^{(tw)}(x,y).$$
(7)

При рассмотрении случая прямолинейных двойниковых границ, как это было показано в [2], функции  $f_1(\xi)$  и  $f_2(\xi)$  будут иметь вид:

$$f_1(\xi) = \frac{H}{2} \left( 1 - \frac{\xi}{L} \right), \tag{8}$$

$$f_2(\xi) = -\frac{H}{2} \left( 1 - \frac{\xi}{L} \right). \tag{9}$$

#### Результаты и их обсуждение

Рассмотрим распределение нормальных компонент  $\sigma_{xx}$  и  $\sigma_{yy}$  тензора напряжений при следующих схемах деформирования поверхности сосредоточенной нагрузкой: 1) P = 0; Q = 0 (рис. 2); 2) P = 100 H; Q = 0 (рис. 3 и 6); 3) P = 0; Q = 100 H (рис. 4 и 7); 4) P = 50 H; Q = 50 H (рис. 5 и 8). Примем: H = 19 мкм; L = 100 мкм;  $b_{\kappa p} = 0,124$  нм, где  $b_{\kappa p}$  – модуль краевой составляющей вектора Бюргерса частичной двойникующей дислокации; для железа: a = 0,248 нм [2] (здесь a – межатомное расстояние).

Линейная плотность двойникующих дислокаций на двойниковых границах определяется по формуле [2]:

$$\rho = \frac{H}{2aL}.$$
(10)

Тогда получим:  $\rho = 3.9 \cdot 10^8 \text{ м}^{-1}$ . В (5) и (6) примем этот параметр постоянным.

На рис. 2 показано распределение нормальных компонент тензора напряжений у клиновидного двойника при отсутствии внешней силы (P = 0; Q = 0). Наблюдается симметричная конфигурация полей напряжений. При этом  $\sigma_{yy}$  положительны у одной из границ двойника и отрицательны – у другой. Локализация напряжений происходит у вершины и на границах двойника. Внутри двойника напряжения неоднородны и максимальное значение достигают у вершины. Область сжатия и растяжения у вершины двойника наблюдается в случае напряжений  $\sigma_{xx}$ . Эти напряжения знакопеременны по отношению к оси *OY*.

В случае действия на поверхность нормальной сосредоточенной нагрузки P = 100 H (рис. 3) при наличии клиновидного двойника с некогерентными границами ситуация меняется. Существенное искажение получают нормальные напряжения  $\sigma_{xx}$  (рис. 3, *a*). Локализация напряжений  $\sigma_{yy}$  происходит в месте действия силы, где оно имеет отрицательное значение напряжений, повышается общий уровень сдвиговых напряжений у двойниковой границы, а максимальное значение достигается у вершины двойника (рис. 3, *б*). Наблюдается несимметричная конфигурация полей напряжений, с положительной областью справа от двойника и отрицательной – слева.

При действии на поверхность сосредоточенной касательной силы Q = 100 Н при наличии клиновидного двойника (рис. 4) напряжения  $\sigma_{yy}$  также локализуются в области действия сосредоточенной нагрузки с образованием двух участков положительных и отрицательных напряжений (рис. 4,  $\delta$ ). Искажения напряжений  $\sigma_{xx}$  в этом случае меньше, чем при действии на поверхность нормальной сосредоточенной нагрузки (рис. 4, a).

На рис. 5 приведены результаты расчета распределения напряжений  $\sigma_{xx}$  и  $\sigma_{yy}$  при P = 50 H; Q = 50 H. Напряжения  $\sigma_{yy}$  достигают максимального значения в месте действия сосредоточенной нагрузки (рис. 5,  $\delta$ ). При этом данные напряжения уменьшили свои значения с удалением от устья двойника. Распределение напряжений  $\sigma_{xx}$  имеет особенность у вершины двойника, где наблюдается область чередования сжатия и растяжения (рис. 5, a).

При сравнении полученных результатов с классическими расчетами полей напряжений в упругом полупространстве, деформируемом сосредоточенной нагрузкой при отсутствии у поверхности двойника (рис. 6, 7, 8), становится очевидным, что наличие двойникования способствует концентрации высокого уровня напряжений вдали от поверхности, где с позиций классических представлений локализации напряжений быть не должно. Отсутствие учета напряжений, обусловленных двойникованием, приводит к ошибкам расчетов. А так как локализация напряжений на двойниковых границах может приводить к образованию трещин, то использование классических методов расчета напряженно-деформируемого состояния, обусловленного сосредоточенной нагрузкой, в случае двойникующихся материалов приводит к непрогнозируемому разрушению, что нежелательно в случае технических систем, к которым предъявляются высокие требования к степени надежности.



у, мкм

*a*)



б)

*Рис.* 2. Распределение нормальных напряжений у клиновидного двойника, находящегося у недеформируемой поверхности:

 $a - \sigma_{xx}$  (MПa);  $\delta - \sigma_{yy}$  (МПа)





*Рис. 3.* Распределение нормальных напряжений у клиновидного двойника, находящегося у поверхности, деформируемой нормальной сосредоточенной нагрузкой *P*:

б)

 $a - \sigma_{xx}$  (MIIa);  $\delta - \sigma_{yy}$  (MIIa)



*Рис. 4.* Распределение нормальных напряжений у клиновидного двойника, находящегося у поверхности, деформируемой касательной сосредоточенной нагрузкой *Q*: a – σ<sub>xx</sub> (МПа); б – σ<sub>yy</sub> (МПа)





б)

*Puc. 5.* Распределение напряжений у клиновидного двойника при действующей в точке *O* сосредоточенной нормальной нагрузки *P* и сосредоточенной касательной нагрузки *Q*:

 $a - \sigma_{yy}$  (MIIa);  $\delta - \sigma_{xx}$  (MIIa)



у, мкм

б)

*Рис. 6.* Распределение нормальных напряжений у поверхности, деформируемой нормальной сосредоточенной нагрузкой *P*:

 $a - \sigma_{yy}$  (MIIa);  $\delta - \sigma_{xx}$  (MIIa)



$$a$$
)



б)

Рис. 7. Распределение напряжений у поверхности, деформируемой сосредоточенной касательной нагрузкой *Q*: *a* – σ<sub>yy</sub> (МПа); *δ* – σ<sub>xx</sub> (МПа)



Рис. 8. Распределение напряжений у поверхности, деформируемой сосредоточенной нормальной нагрузкой *P* и сосредоточенной касательной нагрузкой *Q*:  $a - \sigma_{_{xy}} (M\Pi a); \delta - \sigma_{_{xx}} (M\Pi a)$ 

#### Заключение

В результате разработан метод расчета нормальных компонент тензора напряжений в деформируемом сосредоточенной нагрузкой твердом теле при наличии в нем остаточного двойника с некогерентными границами. Проведенные расчеты показали, что локализация нормальных компонент тензора напряжений происходит в месте действия сосредоточенных сил, что ведет к потере симметрии в конфигурации полей напряжений у клиновидного двойника по сравнению со случаем отсутствия действия внешних сил. Установлено, что наличие двойника в деформируемом упругом полупространстве приводит к концентрации опасных в плане разрушения напряжений в непрогнозируемых классическими методами областях.

## Литература

- 1. Федоров, В. А. Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов / В. А. Федоров, Ю. И. Тялин, В. А. Тялина. М.: Машиностроение, 2004. 215 с.
- 2. Остриков, О. М. Механика двойникования твердых тел / О. М. Остриков. Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2008. 301 с.
- 3. Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. М. : Мир, 1989. 510 с.
- 4. Судзуки, Т. Динамика дислокаций и пластичность / Т. Судзуки, Х. Есинага, С. Такеути ; пер. с яп. М. : Мир, 1989. 296 с.
- 5. Новиков, И. И. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки / И. И. Новиков, К. М. Розин. М. : Металлургия, 1990. 336 с.

Получено 20.12.2013 г.